**臺科****【EM011800】(場發射掃描/穿透式電子顯微鏡FE-S/TEM)儀器預約相關注意事項與樣品檢測申請表:**

1. 第一次預約者，請於預約前，先聯絡儀器負責技術人員，確實討論後，詳細填寫下表回傳預約，違反者取消當日預約。
2. 為減少儀器不必要的污染，本中心對試片種類及試片製備上有以下規定，未符合規定者，本單位有權拒絕受理。

※**必須已於校內【EM0000017504】場發射槍穿透式電子顯微鏡FE-TEM分析確認樣品狀況。**

※粉末樣品(奈米材料): 粉末樣品或奈米材料滴在鍍碳銅網上後，**請務必於80℃以上之溫度，烘乾24小時以上，並於乾燥箱或真空狀態下保**

**存。**若試片放入機台後，機台真空度變差(真空讀值高於標準值Accelerator= 1，Column = 1，Detection Unit < 25)，則實驗中止，樣品立即退

出。

※**具強磁性、磁性或易被電磁透鏡吸引的粉末型式樣品禁用本機台**。磁性判斷及樣品替代製備方式請洽技術員。

※**若有需要使用NanoEx-i/v 加熱載座者，需提供高於100度的分析溫度之TGA與DSC數據，以便觀察樣品升溫分析時的變化。**

|  |  |
| --- | --- |
| 試片元素組成 |  |
| 試片形狀(顆粒、片狀…) |  |
| TEM樣品製備流程(研磨、切片、FIB…)，若為粉末樣品，請詳細說明所使用之溶劑與製備流程。  (相關製備流程可參閱:近代穿透式電子顯微鏡實務一書中，第6章 TEM試片製備) |  |
| 之前此樣品相關分析數據圖(XRD、SEM或TEM) |  |
| 欲分析項目(影像、繞射、或成分) |  |
| 預期結果圖(請提供可參考之TEM結果) |  |
| 學校:  指導教授:  收件者:  聯絡電話:  E-mail: |  |
| 其他 |  |

國立臺灣科技大學穿透式電子顯微鏡(TEM)實驗室20240325

聯絡窗口:儀器負責技術人員:吳盈瑩 小姐、聯絡電話:(02)2733-3141 #7413、E-mail:ying22.Wu@mail.ntust.edu.tw

郵寄樣品住址: 106335臺北市大安區基隆路4段43號，國立臺灣科技大學，材料科學與工程系